



Atelier « Analyse microstructurale des couches minces »

29-30 mai 2012 – IEM Montpellier

Mardi 29 mai 2012 après-midi :

- 14h Présentation des deux jours aux participants – Stéphanie Roualdès
- 14h15 Microscopie à force atomique – Eric FINOT, ICB, Dijon
- 15h15 Diffraction des rayons X sur couches minces - Pierre-Antoine ALBOUY, LPS, Orsay
- 16h15 Pause café
- 16h30 Analyse de porosité par réflectométrie X - Arie VAN DER LEE, IEM, Montpellier

Mercredi 30 mai 2012 :

Matin :

- 9h SIMS et ToF-SIMS : Principes et applications - Yves DE PUYDT, BIOPHY Research, Fuveau.
- 10h Pause café
- 10h15 Caractérisation d'empilements de couches minces par ellipsométrie spectroscopique – Jean-Philippe PIEL
- 11h15 Porosimétrie de couches minces par ellipsométrie et microbalance à quartz – Vincent ROUESSAC, IEM

Après-midi (14h-18h):

4 postes de TP en rotation : ellipsométrie, microbalance à quartz couplée à l'adsorption de gaz, réflectométrie X, visites ciblées de l'IEM